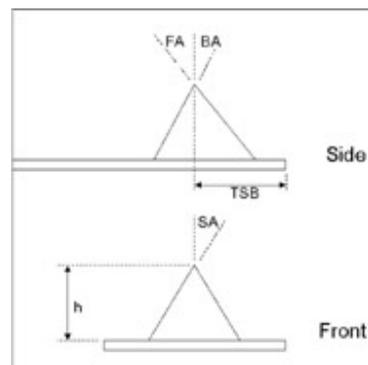
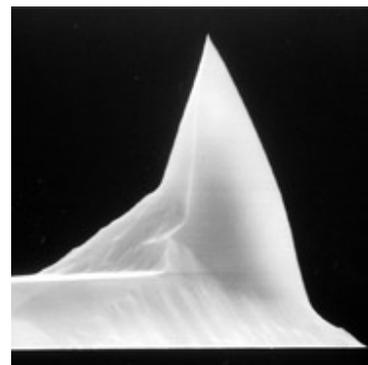


ESP:

Puntas de Silicio para Contacto

Especificaciones de la Punta

Geometría:	Anisotrópico
Altura de la Punta:	10um - 15um
Ángulo Frontal:	25°
Ángulo Posterior:	15°
Ángulo Lateral:	22.5°
Radio de la Punta (Nom.):	<10nm
Radio de la Punta (máx.):	15nm
Tip Set Back (Nom.):	15um
Tip Set Back (Rng.):	5um a 25um
Compensación de Inclinación de la Punta: 0°	0°
Altura de pico (Nom.):	
Altura de pico (Rng.):	
Ancho del pico:	
Ancho del pico (Rng.):	
Proyección:	
Longitud efectivo de cuello:	



Notas:

Producida por NanoWorld Ltd.Co.

Modelo #	Parte #	Montura	Notas	Cant. /paq.
ESP	ESP	Sin montar		10
ESP7	ESP7	Sin montar		70
ESPW	ESPW	Sin montar		385
1950-00	1950-00	Explorer		8

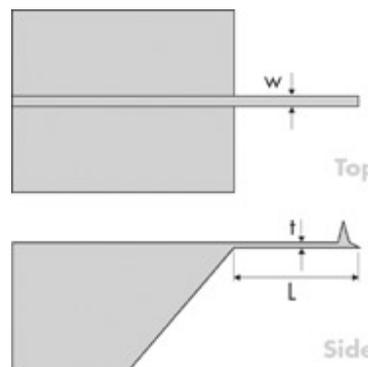
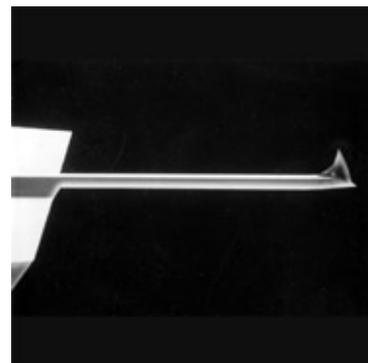
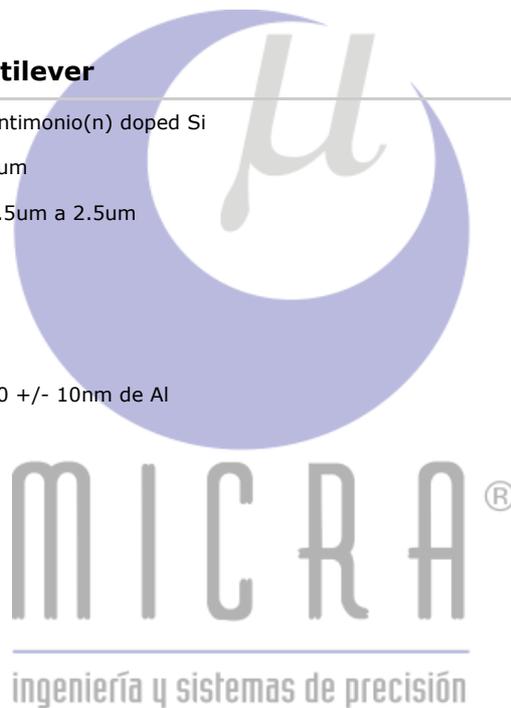
MICRA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

ESP:

Puntas de Silicio para Contacto

Especificaciones del Cantilever

Material:	Antimonio(n) doped Si
Espesor, Nominal:	2um
Espesor, Rango:	1.5um a 2.5um
Recubrimiento frontal	
Capa Inferior:	
Capa Superior:	
Recubrimiento Posterior:	50 +/- 10nm de Al



Notas:

El recubrimiento reflejante de aluminio en la parte posterior del cantilever incrementa la señal láser (A+B) hasta 2.5 veces. Para visualización en general, no es necesario. Se recomienda para cantilevers delgados (<2.5 um) y muestras altamente reflejante

Forma	Longitud (um)			Ancho (um)			Frecuencia (Khz.)			k (N/m)		
	Nom.	Min.	Máx.	Nom.	Min.	Máx.	Nom.	Min.	Máx.	Nom.	Min.	Máx.
A Rectangular	450	405	450	50	45	55	13	10	16	0.2		

MICRA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.